


<b>Search Notes</b>  	<b>Application/Control No.</b>  10592025	<b>Applicant(s)/Patent Under Reexamination</b>  LEE ET AL.
	<b>Examiner</b>  DENE QUEST	<b>Art Unit</b>  3728

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
206	219, 221, 222, 568, 528, 532, 445	9/15/2009	DQ
215	2, 288, DIG 8	9/15/2009	DQ
220	520, 521	9/15/2009	DQ
222	80, 83, 532, 536, 525, 138, 145.1, 541.1	9/16/2009	DQ
426	86	9/21/2009	DQ

SEARCH NOTES		
Search Notes	Date	Examiner
Inventor Search	9/15/2009	DQ
Plus Search	9/15/2009	DQ
East Search	9/15/2009	DQ
Stephen Garbe	9/21/2009	DQ
Frederick Nicolas for Search in 222	9/24/2009	DQ

INTERFERENCE SEARCH			
Class	Subclass	Date	Examiner

--	--